分析测试中心关于场发射透射电子显微镜操作培训通知

（第 34 期）

校内各单位：

分析测试中心日本电子 JEM-F200 场发射透射电子显微镜配置冷场发射电子枪、双探头能谱探测器（探头面积 200 mm2），可实现快速精准的微区分析（仪器参数见附件 1）。为提高大型仪器设备开放共享使用效率，全面满足校内广大师生的需求，分析测试中心对需要相关透射电镜表证的师生进行操作培训，具体安排如下：

一、培训内容

场发射透射电子显微镜（型号：JEOL JEM-F200）的操作技术。

二、培训对象

对透射电子显微镜表征有需求并希望独立操作的校内师生，透射电镜机时使用较多的课题组，具有晶体学理论基础或电子显微镜操作经验的人员将优先考虑。请以课题组为单位按需推荐，本期培训限 10 课题组，每个独立课题组限最多限 1 人报名申请。

三、培训及认证方式

集中理论讲解+上机操作教学、单独自主上机练习和考核。培训内容包括透射电子显微镜原理与基本结构的理论讲解；TEM 成像、选区电子衍射、STEM 成像、能谱仪操作教学等。经

考核通过后，认证为自测用户，可在非工作时间预约测试，且享受测试费用优惠。

四、报名方式与时间安排

即日起至2026年11月15日；请在截止日期前填写申请表（见附件2），导师签字后将扫描件发送至邮箱：zengyuyao@ncu.edu.cn。邮件主题："姓名+单位+XXX课题组+JEM-F200透射电镜培训报名"。中心将对报名申请者的研究方向与需求程度进行综合评估，优先考虑研究方向与仪器契合和使用频率较高的课题组。

五、注意事项

1.费用说明:本次培训集中理论讲解与上机操作教学不收取培训费用。每课题组免费提供3小时单独自主上机练习机时，超出的额外自主上机练习时间须由用户预约电镜机时进行，费用按正常机时费收取。

2.参加培训的学员在自主上机练习后可申请考核，考核通过者获得JEM-F200透射电镜自主上机操作资格，可在非工作时间段预约JEM-F200透射电镜自主测试，并按规定享受测试费用优惠。

3.如对本次培训有任何疑问,请联系曾老师15320037767。

分析测试中心

2026年11月10日